# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平1-205544

⑤Int. Cl. 4

識別記号 庁内整理番号 ④公開 平成1年(1989)8月17日

H 01 L 21/60

W - 6918 - 5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全2頁)

69発明の名称 集積回路装置の組立テープ

> 20特 願 昭63-30278

223出 願 昭63(1988) 2月12日

個発 明 者

誠 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

መ出 願 人 セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

弁理士 最 上 個代 理 人 外1名

1. 発明の名称

集積回路装置の組立テープ

### 2 特許 欝 求の 範囲

(1) 可挠性フィルム上の導体箔表面には集積回 路装置のパッド部及び外部リードとの結合部を除 く、少くとも一主表面にはポリイミド膜等の絶縁 膜が形成されて成る事を特徴とする集機回路装置 の組立テープ。

(2) 可撓性フィルム上の導体 稻 聚面の集 費回路 **遊置のパッド部及び外部リードとの結合部を除く** 、少くとも一主殺面にはポリイミド膜等の絶縁膜 が形成されて成ると共に、前記結合部にはメッキ 層が形成されて成る事を特徴とする集役回路装置 の組立テープ。

3 発明の詳細な説明

( 産業上の利用分野)

本発明は集積回路装置の組立テープ構造に関す る。

### 〔従来の技術〕

従来、集積回路装置の組立テープ構造は、第3 図に要部を示す如き構造をとっていた。すなわち 、ポリイミド・フィルムZMの表面には銅箔22が 前記ポリイミド・フィルム21のパンチング穴に **殺り出したリード級を形成するが如く形成され、** 該 飼 箱 2 2 の 表 面 が I C チップ 2 5 の パッド 部 と 圧接あるいは融濇されるのが通例であった。

#### (発明が解決しようとする課題)

しかし、上記従来技術によると飼りード線の表 面がICチップの角隅部等に接触したり、又、I Cチップの寸法変化に対し、リード線端部を必ず 対応させるためにチップ寸法の変更の都度、リー ド線位置を変えたテープを提供せねばならない等

(2)

の問題点があった。

本発明は、かかる従来技術の問題点をなくし、リード線の接触、短絡不良の起こらない、且つ、チップ、寸法の変更に耐えることができる集破回路装置の組立テーブ構造を提供する事を目的とする。

#### 〔課題を解決するための手段〕

上配問題点を解決するために、本発明は、集積回路装置の組立テープに於いて、可撓性フィルム上の導体箔表面には集積回路装置のペッド部及び外部リードとの結合部を除く、少くとも一主表面にはポリイミド膜等の絶縁膜を形成する手段をとる事、及び、前配結合部にはメッキ層を形成する手段をとる事を基本とする。

#### 〔寒施例〕

以下、実施例により本発明を貯述する。

第1 図は本発明の一実施例を示す要部の断面図 である。すなわち、ポリイミド・フィルム 1 の表

(8)

#### 4 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は本発明の実施例を示す要部の断面図であり、第3 図は従来技術によるI O 組立テーブの要部の断面図である。

2,12,22……銅 箔

る , 1 3 ……ポリイミド膜

4,14 ……パンプ

5 , 1 5 , 2 5 ··· ·· I 0 f y 7

**出願人** 

以上

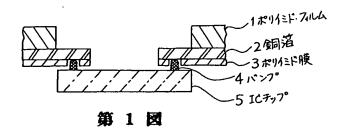
面には銅箔 2 が形成され、前配ポリイミド・フィルム 1 にはパンチング穴が設けられ、酸パンチング穴内に銅箔 2 によりリード級が扱り出すと共に、該銅箔 2 の少くとも一主表面には、ポリイミド膜 3 が 1 C チップ 5 のパンプ 4 と結合する部分を除いて塗布、形成されて成る。

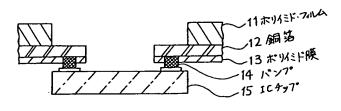
第2図は本発明の他の実施例を示す要部の断面図であり、ポリイミド・フィルム11の装面には 網箔12によるリード線及びポリイミド膜13が 結合部を除いて形成されると共に、該結合部には 、メッキによるパンプ14が形成され、エロチッ ブ15のパッド部と圧着又は触着されて成る。

#### (発明の効果)

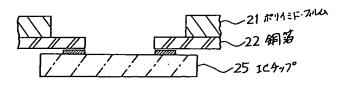
本発明により、リード線のICチップ及びリード線相互の短絡のない、且つ結合部位置を変更するのみでICチップ・サイズの変更に対応出来る 集體回路装置の組立テープを提供する事ができる 効果がある。

(4)





第 2 医



第 3 図

代理人 弁理士 晚上 務(他1名)

セイコーエブソン株式会社

PAT-NO:

JP401205544A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01205544 A

TITLE:

ASSEMBLY TAPE OF INTEGRATED CIRCUIT

DEVICE

**PUBN-DATE**:

August 17, 1989

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME

IWAMATSU, SEIICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

**NAME** 

COUNTRY

SEIKO EPSON CORP

N/A

APPL-NO:

JP63030278

APPL-DATE:

February 12, 1988

INT-CL (IPC): H01L021/60

US-CL-CURRENT: 257/673

ABSTRACT:

PURPOSE: To eliminate the contact of a lead wire and a defect due to a

short

circuit and to change a position of a bonding part by forming an insulating

10/17/2003, EAST Version: 1.04.0000

film on the surface of a conductor foil sheet excluding a pad part and a part to be bonded to an external lead.

CONSTITUTION: A copper foil sheet 2 is formed on the surface of a polyimide

film 1; a punched hole is made in the film 1; a lead wire is projected inside the punched hole by the copper foil sheet 2. A polyimide film 3 is coated and

formed on the main surface of the copper foil sheet 2 excluding a part where

bump 4 of an IC chip 5 is to be bonded. By this setup, the contact of a lead wire and a defect due to a short circuit are eliminated; a position of a bonding part can be changed.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

10/17/2003, EAST Version: 1.04.0000